

基于SEM的Nano-CT系统

Nano-CT System Based on SEM

NanoCT-30



主要技术与性能指标

- 名义最高空间分辨率：200 nm
- 实测空间分辨率：500 nm
- 成像速度：100 s/ 帧
- 加速电压：0.3 V—30 kV
- 最大电子束束流：200 nA
- 可更换 4 种靶材

主要应用

生命科学、材料科学中多孔、多相介质的材料三维无损显微检测

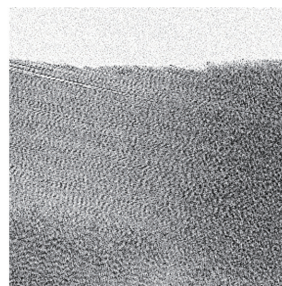
代表性应用成果



靶丸测试



生物成像



材料分析

主要用户单位	中国工程物理研究院
研制单位	中国科学院电工研究所、北京中科科仪股份有限公司
联系方式	刘俊标 010-82547185, 13693629614 liujb@mail.iece.ac.cn